

電機電子類商品型式認可作業要點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
一、 <u>經濟部標準檢驗局</u> (以下簡稱本局)為辦理電機電子類商品型式認可，特訂定本要點。	一、為辦理電機電子類商品型式認可，特訂定本要點。	為明確定義適用機關範圍，爰酌作文字修正。
二、本要點名詞定義如下： (一)大型商品：指體積龐大、搬運不便之商品。 (二)系統複雜商品：指須經專業人員完成安裝或操作之商品。 (三)少量商品：指經由客戶特殊指定而少量生產之商品。	二、本要點名詞定義如下： (一)大型商品：指體積龐大、搬運不便之商品。 (二)系統複雜商品：指須經專業人員完成安裝或操作之商品。 (三)少量商品：指經由客戶特殊指定而少量生產之商品。	本點未修正。
三、申請商品型式認可應檢附技術文件如下： (一)電氣安全規範： 1. 中文使用手冊及規格。 2. 4x6 吋以上彩色照片，含外觀、內部結構及重要零組件之相片（圖）。必要時，得以商品型錄代替外觀彩色照片。 3. 重要零組件驗證證明書或出廠報告或規格書。 4. 產品之電路圖或接線圖或基版銅軌圖。 5. 重要零組件或材料組成規格一覽表。 (二)電磁相容性： 1. 中文使用手冊及規格。 2. 4x6 吋以上彩色照片，含外觀及內部結構。必要時，得以商品型錄代替外觀彩色照片。 3. 電路方塊圖（BLOCK	三、申請商品型式認可應檢附之相關技術文件如下： (一)電氣安全規範： 1. 中文使用手冊及規格。 2. 4x6 吋以上彩色照片，含外觀、內部結構及重要零組件之相片（圖）。必要時，得以商品型錄代替外觀彩色照片。 3. 重要零組件驗證證明書或出廠報告或規格書。 4. 產品之電路圖或接線圖或基版銅軌圖。 5. 重要零組件或材料組成規格一覽表。 (二)電磁相容性： 1. 中文使用手冊及規格。 2. 4x6 吋以上彩色照片，含外觀及內部結構。必要時，得以商品型錄代替外觀彩色照片。 3. 電路方塊圖（BLOCK	一、因應具資訊安全風險商品納入應施檢驗資訊安全規範項目，爰第一項增列第四款有關資訊安全規範之相關技術文件，並配合修正第二項規定。 二、現行規定第一項第四款移列至第五款，並酌作文字修正。 三、考量電動車充電設備、電力轉換系統、太陽光電變流器及放置型鋰儲能裝置等商品已列檢並納入檢驗資訊安全項目，為給予業者因應時間，訂定自一百十七年一月一日起，新申請或申請延展商品型式認可者，應檢附資訊安全規範之相關技術文

DIAGRAM)。 4. 對策元件及干擾源一覽表。 (三)數位接收功能： 1. 中文使用手冊及規格。 2. 4x6 吋以上彩色照片，含外觀、內部結構及解碼 IC。必要時，得以商品型錄代替外觀彩色照片。 3. 電路方塊圖 (BLOCK DIAGRAM)。 4. MPEG 解碼 IC 的編號及製造廠商名稱。 (四)資訊安全規範： 1. 中文使用手冊及規格。 2. 4x6 吋以上彩色照片，含外觀及內部結構。必要時，得以商品型錄代替外觀彩色照片。 3. 資訊安全相關軟體及硬體重要零組件 (如主動晶片、通訊晶片、通訊模組等) 驗證證明書或出廠報告或規格書。 4. 與資訊安全相關硬體結構 (含主動晶片、通訊晶片、通訊模組) 功能方塊圖及軟體程式功能方塊圖或階層圖。 5. 與資訊安全、資通訊相關之軟體物料清單 (SBOM) 及硬體重要零組件或材料組成規格一覽表。 6. 資訊安全自我檢查表。 (五)其他應檢驗需要，經本局指定者。 前項第一款第一目、第二款第一目、第三款第一目	DIAGRAM)。 4. 對策元件及干擾源一覽表。 (三)數位接收功能： 1. 中文使用手冊及規格。 2. 4x6 吋以上彩色照片，含外觀、內部結構及解碼 IC。必要時，得以商品型錄代替外觀彩色照片。 3. 電路方塊圖 (BLOCK DIAGRAM)。 4. MPEG 解碼 IC 的編號及製造廠商名稱。 (四)其他應檢驗需要，經標準檢驗局指定者。 前項第一款第一目、第二款第一目及第三款第一目之技術文件，經標準檢驗局同意時，得以英文為之。 經標準檢驗局公告自行印製型式認可商品檢驗標識之商品，須提供自行印製型式認可商品檢驗標識之樣式及位置說明。	件，爰增訂修正規定第四項。 四、餘酌作文字修正。
--	--	--

及第四款第一目之技術文件，經<u>本局</u>同意時，得以英文為之。 經<u>本局</u>公告自行印製型式認可商品檢驗標識之商品，須提供自行印製型式認可商品檢驗標識之樣式及位置說明。 <u>申請電動車充電設備、電力轉換系統、太陽光電變流器及放置型鋰儲能裝置商品型式認可，自中華民國一百十七年一月一日起，應檢附第一項第四款技術文件。</u>		
四、商品型式試驗，得依下列規定辦理： (一)大型或系統複雜之商品得由指定試驗室進行現場測試。 (二)前款商品測試時需配合之相關週邊設施無法於國內取得者或少量商品之測試，廠商得向<u>本局</u>申請赴國外試驗室進行監督試驗。	四、商品型式試驗，得依下列規定辦理： (一)大型或系統複雜之商品得由指定試驗室進行現場測試。 (二)前款商品測試時需配合之相關週邊設施無法於國內取得者或少量商品之測試，廠商得向標準檢驗局申請赴國外試驗室進行監督試驗。	配合修正規定第一點之簡稱，修正第二款。
五、前點第二款申請赴國外試驗室進行監督試驗，依下列程序辦理： (一)廠商應填具申請書，並檢附國外試驗室之檢測設備及其校正資料，必要時並檢附檢測場地校正資料。 (二)<u>本局</u>得邀集申請廠商協商執行方式。	五、前點第二款申請赴國外試驗室進行監督試驗，依下列程序辦理： (一)廠商應填具申請書，並檢附國外試驗室之檢測設備及其校正資料，必要時並檢附檢測場地校正資料，<u>向標準檢驗局提出申請。</u> (二)標準檢驗局得邀集申請廠商協商執行方式。	配合修正規定第一點之簡稱修正第二款，第一款酌作文字修正。

六、電機電子類商品型式認可證書之有效期間 <u>原則</u> 為三年。	六、電機電子類商品型式認可證書之有效期間為三年。	依商品型式認可管理辦法第九條規定，如遇檢驗標準修正時，以修正前檢驗標準申請之證書有效期間並非三年，爰酌作文字修正。
七、 <u>本局或其所屬分局(以下簡稱檢驗機關)</u> 審查商品型式認可之重行申請、申請系列或核准案件時，得要求申請人提出相關證明文件、技術文件或測試報告。	七、取得型式認可之商品如有變更，應依下列規定辦理： <u>(一)基本設計已變更者，應重行申請商品型式認可。</u> <u>(二)基本設計未變更而有其他應受檢驗項目變更之系列商品，應申請系列商品認可。</u> <u>(三)前款之變更不影響證書登錄事項及商品識別者，向標準檢驗局申請核准。</u> 標準檢驗局審查時，得要求申請人提出相關證明文件、技術文件或測試報告。	一、刪除現行規定第一項與商品型式認可管理辦法第九條第一項重複之規定。 二、配合修正規定第一點之簡稱，並為與商品型式認可管理辦法第九條第一項所定受理變更申請之單位一致，修正第二項並移列本文。
八、商品型式認可證書名義人得申請系列商品型式認可，並依下列方式辦理： (一)應先取得註明系列商品與原型式差異之系列商品型式試驗報告或證明文件。 (二)申請系列商品型式認可，應填具申請書，並檢附原型式認可證書影本、系列商品型式試驗報告或證明文件及相關技術文件，向 <u>檢驗機關</u> 提出申請。	八、商品型式認可證書名義人得申請系列商品型式認可，並依下列方式辦理： (一)應先取得註明系列商品與原型式差異之系列商品型式試驗報告或證明文件。 (二)申請系列商品型式認可，應填具申請書，並檢附原型式認可證書影本、系列商品型式試驗報告或證明文件及相關技術文件，向標準檢驗局提出申請。	為與商品型式認可管理辦法第十條所定申請系列商品型式認可之受理申請及審查單位一致，修正第二款。
九、取得型式認可之商品，除	九、取得型式認可之商品，除	為使有關取得型式認可商

資訊類及僅實施電磁相容性檢驗之商品以每批二十分之一之機率實施抽批檢核外，其餘商品以每批十分之一之機率實施取樣檢驗。<u>但取得型式認可之商品首次報驗時，得採行取樣檢驗，並核對商品標示、內部構造、零組件是否與原型式試驗報告相符。</u> 未抽中批採書面審查方式以簡化檢驗程序，如書面審查不符合，得實施抽批檢核或取樣檢驗。 <u>取樣檢驗不符合之同型式商品</u>，經連續二報驗批取樣檢驗符合後，始得恢復<u>第一項</u>之簡化檢驗程序。 如接獲檢舉或於相關管道得知訊息，對報驗商品符合檢驗標準之一致性有懷疑時，得逕行取樣檢驗。	資訊類及僅實施電磁相容性檢驗之商品<u>得</u>以每批二十分之一之機率實施抽批檢核外，其餘商品<u>標準檢驗局或其所屬轄區分局</u>得以每批十分之一之機率實施取樣檢驗。 未抽中批採書面審查方式以簡化檢驗程序，如書面審查不符合，得實施抽批檢核或取樣檢驗。 取樣檢驗不符合，經連續二報驗批取樣檢驗符合後，始得恢復前項之簡化檢驗程序。 如接獲檢舉或於相關管道得知訊息，對報驗商品符合檢驗標準之一致性有懷疑時，得逕行取樣檢驗。	品之取樣檢驗規定整併陳述，爰現行規定第十點移列至第九點第一項，餘酌作文字修正。
	十、新取得型式認可之商品首次報驗時，標準檢驗局得採行取樣檢驗，核對商品標示、內部構造、零組件是否與原測試報告相符。	一、<u>本點刪除。</u> 二、為使有關取得型式認可商品之取樣檢驗規定整併陳述，本點移列至第九點第一項，並酌作文字修正，爰予刪除。
<u>十</u>、未取得型式認可而依規定辦理先行放行之報驗案件，於取得商品型式認可證書後，應逕行取樣檢驗，<u>並</u>核對商品標示、內部構造及零組件是否與原型式試驗樣品相符。	十一、未取得型式認可而依規定辦理先行放行之報驗案件，於取得商品型式認可證書後，<u>受理報驗單位</u>應逕行取樣檢驗，核對商品標示、內部構造及零組件是否與原型式試驗樣品相符。	點次變更並酌作文字修正。